

XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存  
DBでの共有レベル: 共有

解析条件

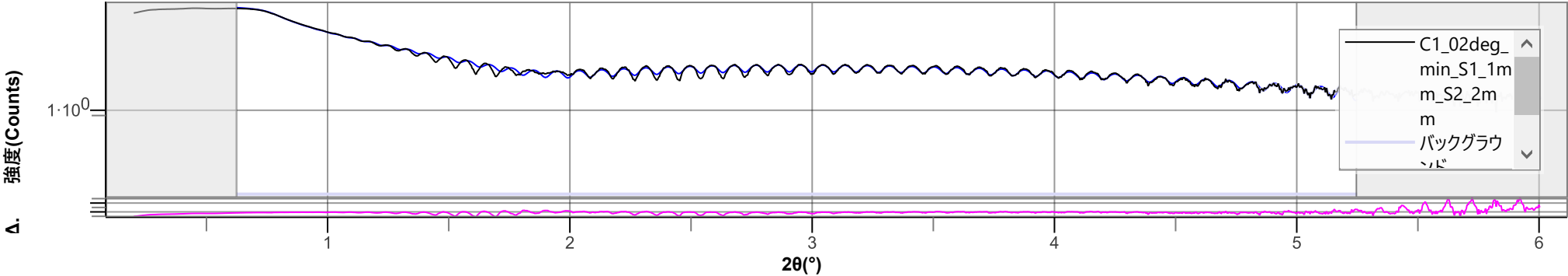
波長(nm): 0.15403  
点数: 1451  
2θ(°):開始 = 0.200, 終了 = 6.000  
ステップ = 0.004  
オフセット = 0.000e+000

フィッティング手法: 準ニュートン  
データ間隔:1点ごとにフィッティング  
残差タイプ: |Δ(LogI)|  
最大反復数: 500  
許容誤差: 1.00e-010

装置関数: 擬Voigt関数  
ローレンツ関数の比率: 0.00  
ローレンツ幅: 1.00e-002  
ガウス幅: 1.00e-002

結果

プロファイルプロット



	使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)<th>	密度(g/cm³)<d>	粗さ(nm)<rg<	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L5	Fe2O3	0.541 ±0.011 Const 精密化	4.95000 ±0.06 Const →最大 精密化	0.357 ±0.008 Con... 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L4	Fe2O3	1.581 ±0.01 Const 精密化	2.47500 ±0.019 最小← Const 精密化	0.100 ±0.02 最小← Con... 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L3	Fe	2.556 ±0.8 Const 精密化	7.57477 ±0.013 Const →最大 精密化	0.000 ±0.013 最小← Con... 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L2	Fe	89.186 ±0.016 Const 精密化	7.86493 ±0.02 Const →最大 精密化	0.100 ±0.04 最小← Con... 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L1	Fe	2.632 ±0.08 Const 精密化	4.60964 ±0.07 Const 精密化	0.100 ±0.04 最小← Con... 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞	2.32924 Const	0.500 Con...	